Belle II Aerogel RICH 検出器の建設と運転

KEK 素粒子原子核研究所 西田昌平 shohei.nishida@kek.jp

2019年 (令和元年) 8月 20日

1 はじめに

2019 年 3 月, Belle II 実験 [1] が本格的に開始した。 Belle II は 2010 年までデータ収集を行った Belle の後 継実験で,7 GeV の電子と 4 GeV の陽電子を衝突させ る SuperKEKB 加速器を用いて Belle の 50 倍となる 50 ab⁻¹ のデータを蓄積する予定である。SuperKEKB は 2016 年には Belle II 検出器なしの Phase 1 運転を, 2018 年には崩壊点検出器以外の Belle II 検出器をイン ストールしての Phase 2 運転を行い、今年から全ての 検出器をインストールした物理ランである Phase 3 運 転を開始した。Belle II 検出器は、これまでの Belle 検 出器 [2] と外見はほぼ同じであるが、ルミノシティが 40 倍になることによる高レート、高バックグラウンドに耐 えられるように、また Belle 検出器よりも性能を向上さ せるため,中に設置されている検出器は大幅にアップグ レードされた。その一つ、前方エンドキャップの粒子識 別装置として新たに導入した Aerogel RICH 検出器(以 下 ARICH) [3] を紹介したい。この記事では、ARICH の各要素の研究開発などについては省略し、建設とコ ミッショニングを中心に述べる。

2 Aerogel RICH 検出器の概要

Belle II のようなフレーバー物理の実験では、荷電 粒子の粒子識別性能が鍵となる。特に $K \ge \pi$ の識別 は、フレーバータグや新物理探索のための稀崩壊の測定 に重要である¹。Belle 検出器では、Aerogel Cherenkov Counter (ACC) [4] と、飛行時間検出器 (TOF),中央 ドリフトチェンバー (CDC) の dE/dx の情報を組み合 わせて K/π 識別を行っていた。ACC はエアロゲル輻 射体からのチェレンコフ光の有無によって荷電粒子の速 度がある閾値以上であるかを判定する検出器で、CDC による運動量情報と組み合わせて粒子識別を行う検出器 である。閾値型なので, K/π 識別に着目した場合には 特定の運動量の領域のみで識別が可能になる。Belle の バレル部分では TOF が概ね 1.5 GeV 以下の K/π 識 別を行い, ACC が 1.5–3.5 GeV の高運動量領域を担当 していたが,前方エンドキャップ領域には TOF が設置 されていないため, ACC はフレーバータグで重要にな る 0.5–2.5 GeV の運動量領域を担当し,それ以上の運 動量領域の識別はできなかった。Belle II へのアップグ レードでは,前方の粒子識別用に ACC にかえて新検出 器 ARICH を開発,導入し,より広い運動量領域に対応 しつつ粒子識別性能の向上を図ることとした。

図 1(a) に ARICH の原理を示す。荷電粒子が輻射 体であるエアロゲルを通過した際に発生するチェレン コフ光を 20 cm ほど離れたところにある位置分解能の ある光検出器で測定することにより、チェレンコフ角 $\theta_{\rm C}$ を測定する。 $\theta_{\rm C}$ と荷電粒子の速度 β ,輻射体の屈折 率 n には $\cos \theta_{\rm C} = 1/(\beta n)$ という関係があるので、荷 電粒子の運動量 p を別に測定すれば、荷電粒子の質量 $m = (p/c)\sqrt{n^2 \cos^2 \theta_{\rm C} - 1}$ を測定でき、粒子識別を行え る。このようにチェレンコフ光の作る像から θ_C を測定し て粒子識別を測定する装置を Ring Imaging CHerenkov (RICH) 検出器という。一般の RICH 検出器では $\theta_{\rm C}$ の 測定を容易にするため、チェレンコフ光を鏡で反射させ るなどして輻射体から光検出器までの距離をできるだけ 大きくとるようにすることが多い。しかし, Belle II の ARICH 検出器では、もともと Belle の ACC があった 場所にインストールするという制約から,奥行き 30 cm の空間に装置を収める必要があり、近接型の RICH と いう選択になった。

輻射体の屈折率を 1.05 とすると, $\theta_{\rm C}$ は 0.3 rad 程 度となるが, 4 GeV の K と π の $\theta_{\rm C}$ は 23 mrad 異 なる。検出器の荷電粒子あたりの角度分解能は、荷電粒 子あたりの検出光子数 $N_{\rm pe}$, 1 光子あたりの角度分解能 $\Delta\theta_{\rm C}$ を用いて $\Delta\theta = \Delta\theta_{\rm C}/\sqrt{N_{\rm pe}}$ となるので,これが 23 mrad と比べてどの程度小さくできるかでおおまか な粒子識別性能が決まる。高い粒子識別性能を得るには

 $^{^1}$ この記事では K, π はそれぞれ荷電 K, 荷電 π をあらわすもの とする



図 1: (a) ARICH の原理。点線の矢印は荷電粒子。屈折 率が異なる 2 層のエアロゲルを輻射体に用いることによ り,光検出器上でチェレンコフ光のイメージが重なるよ うになっている。(b) ARICH 検出器。

 $N_{\rm pe}$ を大きくすればよく,例えば,より透明で厚いエア ロゲルを用いればよい。しかし,エアロゲルを厚くすれ ば $N_{\rm pe}$ を大きくできるが,チェレンコフ光が厚み方向 のどの位置で発生したかという不定性が増えてしまい, $\Delta\theta_{\rm C}$ が大きくなって性能悪化の方向に働く。この矛盾を 解決するため,ARICH では図 1(a)のように,屈折率 の異なる2種類のエアロゲルを用いることにした。これ により光検出器上でチェレンコフ光のイメージが重なる ようになっており,エアロゲルを厚くしても $\Delta\theta_{\rm C}$ を悪 化させずに $N_{\rm pe}$ を増加させるようになっている。最終 的に,ARICH では,屈折率がn = 1.045とn = 1.055で,それぞれ厚さ2 cmのエアロゲルを用いることした。

図 1(b) に ARICH の全体図を示す。ARICH は内径 425 mm 外径 1140 mm のドーナツ型のような形をして おり, Belle II の前方に位置する。衝突点に近い上流側 (図の左側) にエアロゲルが,下流側に3節で説明する光 検出器 HAPD があり,側面には光検出器の acceptance 外に出て行くチェレンコフ光を反射させるための鏡が設 置されている。エアロゲルは一辺 18 cm の正方形のも のを扇型状にウォータージェットで切断したものを 248 枚²,光検出器 HAPD は 7 つの同心円状 420 個が設置 される。ARICH の Belle II 検出器内での配置を示すと 図 2 のようになる。

3 光検出器 HAPD

ARICH で用いる光検出器は、1 光子が検出器可能で、 Belle II 内の 1.5 T の磁場中で動作可能でなければな らない。また、前述の構成を仮定すれば、5 mm ほど の位置の解像度が必要となる。これらの条件を満たす検



図 2: Belle II 検出器内の ARICH 検出器。内側に見え る3つのディスク状のものが, 衝突点(図の右側)から, ARICH のエアロゲル輻射体, 光検出器 HAPD, 前方 エンドキャップカロリーメータ。 (CRey.Hori 。

出器として, 144 チャネルの角型の Hybrid Avalanche Photo Detector (HAPD) [5] を浜松ホトニクスと共同で 開発した。

図 3 に HAPD の写真と構造を示す。入射した光は光 電面で変換されてできた光電子が、印可された -8 kV程度の高電圧(以下, HV)で加速され,管内に設置され た 4 台の Avalanche PhotoDiode (APD) に打ち込まれ る。4 台の APD には、それぞれ独立に 350 V の逆バイ アス電圧(以下,バイアス電圧)が印可され、光電子の 打ち込みで生成された 1800 程度の電荷がさらに雪崩増 幅を起こす。この打ち込みによる増幅と、APD 内のア バランシェ増幅の 2 段階の増幅機構で、合計 70000 程度 のゲインが得られる。表 1 に HAPD の仕様を載せる。 なお、Belle II は Belle に比べて大きな放射線の影響が 予想されており、実験期間とされる 10 年間に 1 MeV 換 算で 10^{12} cm^{-2} の中性子を浴びると予想される³ため、 APD の構造の改良などにより要求される耐放射線性を 備えた HAPD を開発した。



図 3: (a) 144 チャネル角型 HAPD。(b) HAPD の原理。

HAPD は,光電子の打ち込みによる増幅という機構 からゲイン揺らぎが少ないという利点がある一方,ゲ イン自体は光電子増倍管よりも低いため,低ノイズ高 ゲインの読み出しエレクトロニクスが必要になる。後述

²前述の通り,屈折率が異なる2枚が対になっているので,エアロゲル面で見ると124個に分割されている

³このため MPPC (SiPM) は光検出器として採用できなかった。

表 1: HAPD の仕様。

外寸	$73~\mathrm{mm}\times73~\mathrm{mm}$
有効光電面	$63~\mathrm{mm}\times 63~\mathrm{mm}$
光電面量子効率	28 % (24 % 以上)
チャネル	144 (36×4 APD chips)
パッドサイズ	$4.9~\mathrm{mm}\times4.9~\mathrm{mm}$
電子照射ゲイン	1800 (1500 以上)
アバランシェゲイン	40 (30 以上)

のとおり ARICH の読み出しチャネル数は 60480 と多 いものの,必要な情報は各チャネルのヒットの有無だけ というやや特殊な条件もあり,ARICH 用に読み出し用 の ASIC を開発した [6]。図 4 に読み出しエレクトロニ クスの概要を示す。HAPD の裏面に Front-end Board (FEB) と呼ぶボードが直接装着される。この FEB には, 開発した ASIC 4 つとデジタル処理用の FPGA が実装 される。その後段には Merger Board と呼ばれるボード があり,FEB 6 台ないし 5 台の信号を収集する。これ らは全て ARICH 検出器内部に設置される。Merger に は光ファイバーが接続されており,Belle II 実験共通の 読み出しプロトコルである Belle2Link で読み出しが行 われる。



図 4: HAPD 読み出しエレクトロニクス。

4 HAPD の磁場中の振舞

HAPD の量産を開始したあとに分かった問題が、磁場 中で発生する異常に大きな信号である。量産を始める前 に, KEK の北カウンターホールにある FANTASQUE 磁石で磁場中での HAPD の振る舞いについて調査を 行っていた。ここで,いくつかの HAPD について磁場 中での正常動作を確認した上で量産に踏み切ったわけ である。ところが,量産した HAPD を順次,磁場中で テストしたところ、一部の HAPD が巨大な信号を発生 し、読み出しエレクトロニクスを破壊するか、破壊し ないまでも 0.1 秒のオーダーで麻痺状態にしてしまうと いうことがわかった。図5に信号の例を示す。この症 状は,発生頻度に個体差がある,HVを印可した時のみ (特に HV を上げている時と上げた直後に)発生する,1 つの HAPD の全て又は大半のチャネルに同時発生する, 0.1-0.6 T の時が発生しやすい, などの特徴があった。 これらから, HAPD の管の側面で電子が雪崩のように 増幅される flashover 現象でないかとも考えられたが、4 台の APD に印可するバイアス電圧が均一である方が起 こりやすい,というような理解できない特徴もあって, 原因を完全には特定できていない。



図 5: 磁場中で HAPD でみられた巨大な信号(右)。左 が正常な 1~ 数光子信号。左右で,電圧,時間軸が異な ることに注意。

一方で,発生の有無の個体差を理解しようと,浜松ホ トニクスにて製造の時期や手順との依存関係などを調 査するうちに,問題のある個体についても,ゲッターの 再活性を行うとこの問題が劇的に改善することが判明 した。ゲッターというのは HAPD 内についているパー ツで,ここに電流を流して加熱すると,管内のガスを吸 着して真空度を上げることができる。本来は製造の際に ゲッターを活性化(加熱)するのであるが,完成後に追 加で再度加熱するのがゲッターの再活性化である。そこ で,量産された HAPD は一度全数を磁場中で試験を行 い,巨大信号問題があった個体については浜松ホトニク スに送り返し,ゲッター再活性を行ってもらい,再度磁 場中で試験を行う,という手順で,最終的に必要な個数 の HAPD を揃えることができた。

なお,読み出しエレクトロニクスについては,巨大な 信号が来ても壊れないように,保護機構を追加すること になった。量産後の試験を終えた HAPD は,FEB を 装着した上で再度の試験を行ってから,組み立てへと進 んだ。

5 ARICH の建設

ARICH の建設は,エアロゲルと HAPD をそれぞれ 別のアルミの構造体のなかにインストールしてから,最 後に合わせるという手順で行った。建設は,Belle II があ る筑波実験棟の地下4階の側室で行った。このうち,エ アロゲル側は2016年のうちにインストールが完了した。

HAPD 側の組み立ては,HAPD に FEB を装着した ものを,アルミの構造体に固定するという手順で行った。 こちらは,前述の磁場中での問題の他,高電圧のコネク タやケーブルの選定の遅れなどもあり,本格的なインス トールは 2017 年以降になった。それでも 2016 年中に は一部の HAPD と読み出しエレクトロニクスを構造体 にインストールし,テスト用のエアロゲルを用いた宇宙 線テストを行い,宇宙線ミュオンの作るチェレンコフリ ングを観測することができ,基本的な動作を確認するこ とができた。

HAPD のインストール自体は 2017 年 5 月末に完了し た。図 6 に, HAPD 側の構造体とともにとった ARICH グループのメンバの記念写真をのせる。ARICH グルー プは, KEK と首都大, 千葉大, 東邦大, 名古屋大, 新 潟大, スロベニアの Jožef Stefan Institute, フランス の LAL からなる Belle II の中では比較的人数の少ない グループである⁴。この時点では, HAPD の設置された 表側から見るとほぼ完成しているが, 裏側の読み出しエ レクトロニクスはまだインストール中, という状況で, HAPD と一体化されている FEB 以外の Merger やケー ブルのインストールはこのあとも続き, 7 月末にようや く完成した。



図 6: HAPD のインストールが完了した ARICH の光 検出器側の構造体。

2017 年 8 月 9 日に ARICH のエアロゲル側と HAPD 側の合体を行った(図 7)。ちなみに,エアロゲル側の 全体を見ることができたのはこの日だけであった。こ れ以降,エアロゲルや HAPD には修正を加えることは

できなくなったが、読み出しエレクトロニクスにはまだ アクセス可能であり、このあと1ヶ月程度の間、ケーブ ルの最終的なインストールや,データ収集のテストを 行いながらエレクトロニクスの調整などを行った。図8 に、ARICHの裏側のエレクトロニクスの写真をのせる。 HAPD の背面には 5 cm くらいの空間しかなく、ここ に、Merger Board や読み出し用のケーブル、高電圧関 係のケーブルやボードの電源用のケーブルなどを収める 必要がある。写真はケーブルのインストール途中の様子 で,最終的にはさらに繁雑な様子になった。その一因は, HAPD1台につき,高電圧と4つのAPDのバイアス, 保護用のガード電圧の6種類の電圧が必要になるから で、これらのケーブルは検出器外部に引き出す必要があ り、このあとも Belle II 検出器内の限られたスペースに 取り回すのに苦労した。なお、エレクトロニクスのイン ストールが終わると、ARICH のエレクトロニクス側も アルミの板で蓋をして、検出器としては完成である。



図 7: ARICH 検出器のエアロゲル側と HAPD 側の合体の様子。



図 8: ARICH 検出器のエレクトロニクス。

その後,9月13日にARICHを前方カロリーメータと 合体させ(以後,前方エンドキャップと呼ぶ),9月20 日に Belle II 検出器内へのインストールをした。といっ ても,前方エンドキャップは,Belle II 検出器内の内部の 検出器へのアクセスを可能にするため外側に引き出した り,定位置に押し込んだりできるようになっており,こ

⁴建設当時。その後, 北里大とアルメニアの Alikhanyan National Science Laboratory も加わった。

の時点では外側にあって,まだケーブルなどが接続され ていない状態であった。前方エンドキャップを定位置に 押し込むのにも,(ARICH だけの問題ではないが)ケー ブルや配管の干渉があって一苦労あったのだが,それは 省略することにして,10月末と12月に定位置に入れて のケーブルの接続およびコミッショニングを行った。こ の時期は,Belle II の崩壊点検出器⁵などの作業と並行 しておこなっていたため,そちらの作業の関係上,前方 エンドキャップを外側に引き出している期間も長かった が,その間は延長ケーブルなどを使って部分的に読み出 しテストなどを行った。年をまたいだ 2018年1月末に 前方エンドキャップを定位置に移動し,ケーブルを接続 して,いよいよ Phase 2 運転に備えることとなった。

6 Phase 2 での ARICH の運転

SuperKEKB の Phase 2 運転開始は 2018 年 3 月 19 日であったが, Belle II ではその前から宇宙線を用いたコ ミッショニングを行っていた。Belle II でトリガーされる 宇宙線で ARICH で検出できるものは, ARICH の下半 分を通過するものに限られるが⁶, 図 9 のように ARICH を通過した宇宙線が作ったチェレンコフリングを検出し たイベントを観測することができ,一応 ARICH が動 作することが確認できた。



図 9: Belle II インストール後の宇宙線データで確認された ARICH のチェレンコフリング。青線が宇宙線。

Phase 2 運転では,4月26日に SuperKEKB 初の電子 陽電子衝突事象を観測し,7月17日まで運転を行った。 この間,ARICH もデータ収集を継続してコミッショニ ング運転を行ったが,いくつか問題を抱えており,本格 運転とは言えない状態であった。 最大の問題は,エレクトロニクスの冷却が不十分で, ARICH 内の温度が上昇してしまったことである。これ は,前方エンドキャップの Belle II インストール後には わかったことではあるが,全てのエレクトロニクスを動 作させようとすると,FPGA の温度は 60-70 °C に達し, 数時間で内部の温度が 50 °C 近くまで上昇してしまう。 そこで,Phase 2 では ARICH 全体を動作させるのはあ きらめて,一部だけを動作させることにした。図 10 が, Phase 2 での ARICH のヒット分布で,図の左右にある ような 2 種類の構成で運転していた。ここで,括弧内で かかれているのがセクタ番号で,1 セクタが ARICH の 1/6 に相当する。つまり,Phase 2 では,テスト目的で 数時間だけ全セクタを動作させることはあったが,通常 は 6 セクタ中 3 ないし 4 セクタだけを動作させていた のである。



図 10: Phase 2 での ARICH のヒット分布。冷却の問 題のため Phase 2 では一部のセクターのみ運転してい た。異なる期間のものを 2 通り示す。括弧内はセクター 番号。

また,読み出しにも問題が見られた。420 台の HAPD の読み出しは,72 台の Merger Board から Belle II 共 通の読み出しプロトコルである Belle2Link を用いて光 ファイバーで読み出しているのであるが,このうちの10 台ほどの Merger に問題があった。その症状は,全く動 作しないものから,ラン開始後短時間でエラーになるも のなど様々であったが,Phase 2 ではこれらの読み出し は断念せざるを得なかった。図 10 にて,HAPD 6 台く らいの固まりでヒットが無い場所が多数存在するのはこ のためである。この他,ファームウェアが不安定である などの問題もあったが,これらは Phase 2 中にデバッグ を行い,徐々に修正を行った。

このような状況であったが,不完全なデータではある が ARICH のデータの解析を行い,ソフトウェアの整備 や,アラインメント,データベースの整備などを行い, 一通りのフローを確認することができたので,有意義で あった。また,稼働している部分に着目して,検出光子 数やチェレンコフ角分布などの基本的なパラメータを確 認したところでは,概ねシミュレーションの予想値に近 い値が得られていたので,全体を動作させることができ

⁵冒頭で Phase 2 ではインストールしないと述べたが,実際には テスト的に一部がインストールされた

⁶宇宙線は衝突点近辺を通過しないとトリガーされない。上半分を 通過するものは ARICH を背後から通過するので,チェレンコフ光 が HAPD 側に放出されない。

れば、目的の性能が得られそうだ、という感触はあった。 いずれにせよ、前述の問題を解決するには、再度ハー ドウェアに修正を加える必要があったので、Phase 2 終 了後の Belle II の崩壊点検出器のインストールの時間を 利用し、前方エンドキャップ を一旦 Belle II からアンイ ンストールして解体し、ARICH のエレクトロニクス側 に修正を加えることとした。

7 Phase 3 での ARICH の運転

Phase 2 運転が終了して ARICH を取り出すと, 直ち に ARICH の改修にとりかかった。最大の問題は冷却 能力不足であるが、問題が判明してから、LAL のエン ジニアの協力を得て、新しい冷却系の開発にとりかかっ ていた。ARICH で発生する熱のほぼ全てはエレクトロ ニクスによるもので、中でも FEB と Merger に実装さ れている FPGA がかなりの部分を占めるが,最初のも のはこれらを直接冷却する構造になっていなかった。新 しい冷却系は以前と同じ水冷式ではあるが, Merger の FPGA をアルミの治具を介して直接冷却できるように した。FEB の FPGA は直接は冷却できないが、FEB の FPGA と ARICH の構造体の間に熱伝導体を加え て FPGA の熱が構造体に逃げるようにし, Merger の FPGA を冷やす治具が構造体からの熱も取り除けるよう にした。Merger やケーブルを一旦全て取り除いてから, この新しい冷却系をインストールしたところ, FPGA を 含む ARICH 温度も 40°C 以下に保つことができた。

また, Merger の読み出しの不具合については, この機 会に調査をした結果, 大半はトリガーやタイミングを担っ ているケーブルの不良であることが判明した。Phase 2 前には試験に充分な時間がとれなかった他, 読み出しの ソフトウェアも開発途上だったこともあり, 見逃されて いたものと思われる。不良ケーブルの交換などをおこ なった結果, Phase 3 では全ての Merger から安定して データを読めるようになった。

これらの ARICH の改修を終え,2018 年内に前方エ ンドキャップは再度 Belle II にインストールされた。こ の間に崩壊点検出器のインストールも完了し,ついに Belle II 検出器が完成したのである⁷。2019 年 3 月 11 日 に SuperKEKB の運転がはじまり,ここに Phase 3 運 転すなわち Belle II の本実験がはじまったのである。

図 11 に Phase 3 での ARICH のヒット分布を示す。 Phase 2 と異なり, ARICH 全体が稼働しており, Merger の不具合による大きくヒットが抜けた領域などもない。 内側の方が, バックグラウンドイベントの影響でヒット レートが高いのがわかる。一部, HAPD 内の APD の単 10-

100

位(HAPD の 1/4 に相当する 36 チャネル単位)でデッ ドチャネルがある。その主な原因は HAPD 内の APD そのものの不良でバイアス電圧をかけられなくなってい るのであるが,そのような APD は全体の 1% 程度であ る。この他に,ケーブルの不良と疑われるもの,HAPD や ASIC のデッドチャネルの他,ソフトウェア的な問 題なのかランによっては動作しない HAPD などがある が,それらを含めても不良チャネルの割合は全体の 2% 以下で,粒子識別性能への影響は軽微である。

Number of hits / APD / event

図 11: Phase 3 での ARICH のイベントあたり APD あ たりのヒット分布。ところどころヒットが多い APD は ノイズの多いチャネルを含んだもの。縦軸,横軸の単位 は cm。

0

50

-100

-100

-50

また, Phase 2 中ではファームウェアの問題があるな ど, ARICH の, というよりどの検出器も, データ収集 は不安定であり, 運転中に問題が生じた場合に Belle II のデータ収集から外されてしまうことも時々あったが, Phase 3 では常に Belle II のデータ収集に組み込まれて 動作している。7 月 1 日まで行われた 2019 年の春の運 転では,細かな問題や発生頻度の低い問題はあるものの, 安定に動作したといってよい状況である。

最後に,2019年の春の運転で得られた ARICH の性 能について記す。なお、以下の結果は暫定的なものであ り、今後のキャリブレーションやアラインメントなどで 値は変わる可能性がある。また、ソフトウェアの改良に よって、結果も改善することが予想される。

図 12 は, $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ イベントで得られた ARICH の光子のチェレンコフ角分布である。シミュレーション では,荷電粒子あたりの光子数 $N_{\rm pe} = 11.3, 1$ 光子あた りの角度分解能 $\Delta\theta_{\rm C} = 12.8$ mrad に対し,データでは $N_{\rm pe} = 11.4, \Delta\theta_{\rm C} = 12.7$ mrad が得られている。これ は,荷電粒子あたりの角度分解能 $\Delta\theta = \Delta\theta_{\rm C}/\sqrt{N_{\rm pe}} =$ 3.8 mrad に相当し,単純計算では 4 GeV の粒子に対 して, 6.1 σ の K/π に識別能力ということなる。なお,

⁷但し,崩壊点検出器の2層めに位置するピクセル検出器の一部の インストールは次の機会に先送りになった。

図 12 の $\theta_{\rm C} = 0$ 付近のピークは HAPD の窓材で発生 したチェレンコフ光の寄与で、シミュレーションとデー タに乖離が見られる。こういったことを含め、検出器の 完全な理解にはさらなる研究が必要である。



図 12: Phase 3 でのチェレンコフ角分布。縦軸は arbitrary。

また,図 13 は $D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+_{slow}, D^0 \rightarrow K^- \pi^+$ (荷電 共役を含む)を用いて得られた ARICH の粒子識別性 能である。このモードのよいところは, π^+_{slow} の電荷を 見れば, D 中間子の崩壊によって出てくる K, π の電荷 がわかるため, K/π の識別性能と誤識別率を同時に求 めることができることである。図では,異なる K 識別 の選別条件に対する K の識別効率と, π の K への誤 識別率が示されている。この図は 0.7 GeV 以上の粒子 を集めたもので,粒子識別性能の理解のためには,運動 量との依存関係をみないといけないが,ともかく実際に K/π 識別を行うことができていることを示している。



図 13: $D^{*+} \rightarrow D^0 \pi^+_{\text{slow}}, D^0 \rightarrow K^- \pi^+$ を用いた ARICH の粒子識別性能。

8 おわりに

Belle II の Phase 3 が始まり,この春に 3ヶ月程度 の運転を行った。運転時のルミノシティは典型的に 3– 5×10³³ cm⁻²s⁻¹ 程度で,6.5 fb⁻¹ のデータを収集し た。この間,Belle 実験で行っていたような continuous injection (Linac からの入射を行いながら,電子と陽電 子の衝突を行う運転)でのデータ収集に成功するなど, 本格的なデータ収集の準備が進んでいる一方で,ビー ムバックグラウンドが高く,Belle II の検出器を動かし た状態でルミノシティを上げることができないという課 題がある。実際,春の運転の最後には SuperKEKB は 1.2×10^{34} cm⁻²s⁻¹ という KEKB の設計値以上のルミ ノシティを記録したものの,この時には Belle II 検出器 は高電圧をかけていない状態であった。

ARICH は、Phase 2 でみつかった問題を克服して、 Phase 3 では予想以上にうまく動作している。しかし、 Belle II の目標とするルミノシティは 8×10^{35} cm⁻²s⁻¹、 蓄積するデータ量は 50 ab⁻¹ であるから、まだほんの第 一歩を踏みだしたところである。今後、より高いバック グラウンドと高いルミノシティのもとで、トリガーレー トやデータのバンド幅が増えた状況でも、安定して動作 させるように、努力したい。

参考文献

- Z. Doležal *et al.*, "Belle II Technical Design Report", arXiv:1011.0352.
- [2] A. Abashian *et al.* (Belle Collaboration), Nucl. Instrum. Meth. A **479**, 117 (2002).
- [3] T. Iijima *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **548**, 383 (2005); S. Nishida *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **766**, 28 (2014); S. Iwata *et al.*, PTEP **3**, 033H01 (2016).
- [4] T. Iijima *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **453**, 321 (2000).
- [5] S. Nishida *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **610**, 65 (2009).
- [6] S. Nishida *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. A **623**, 504 (2010).